(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-185632

(43)公開日 平成8年(1996)7月16日

(51) Int.CL.4

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G11B 7/007 7/095

9464 – 5D

C 9368-5D

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 4 頁)

(21)出顧番号

特顧平6-339561

(22)出顧日

平成6年(1994)12月28日

(71)出顧人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 松尾 憲雅

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー

株式会社内

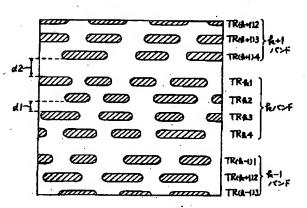
(74)代理人 弁理士 田辺 恵基

# (54) 【発明の名称】 光デイスク及び光デイスク装置

## (57)【要約】

【目的】本発明は光デイスクにおいて、特別な光学系を 用いなくても複数のトラツクから記録情報を同時に読み 出すことができる光デイスクを提供する。

【構成】複数のトラツクでなるトラツク東をバラレルスパイラル状に形成し、かつトラツク東間のトラツク間隔をトラツク東内のトラツク間隔より広く形成する。これにより特別な光学系を用いなくてもトラツキングのずれを容易に検出でき、複数のトラツクから記録情報を同時に読み出すととができる。



図! 光検出器の受光面

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】複数のトラツクでなるトラツク束がパラレ ルスパイラル状に形成されており、かつ上記トラック東 間のトラツク間隔は上記トラツク東内のトラツク間隔よ り広く形成されていることを特徴とする光デイスク。

【請求項2】上記トラツク東を構成する上記複数のトラ ツクには互いに関連のある情報が記録されていることを 特徴とする請求項1に記載の光デイスク。

【請求項3】複数のトラツクでなるトラツク東がパラレ ルスパイラル状に形成されており、かつ上記トラツク東 10 間のトラツク間隔は上記トラツク東内のトラツク間隔よ り広く形成されている光ディスクの所定領域を照射し、 その反射光を受光素子上に結像する光ピツクアツブ部

上記受光素子上に並んだ複数の受光セルからそれぞれ出 力される出力信号の差出力に基づいてトラッキングエラ 一信号を生成する信号処理部とを具えることを特徴とす る光デイスク装置。

【請求項4】上記複数の受光セルは、上記受光素子の受 光面に結像される上記トラック束内のトラックビッチと 同ピツチで配置されていることを特徴とする請求項3に 記載の光ディスク装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光デイスク及び光デイス ク装置に関し、特に互いに関連のある情報が複数本のト ラツクに記録された光ディスク及びこれを再生する光デ イスク装置に用いて好適なものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、光デイスク装置では情報記録面に 30 形成された多数本のトラツクのうち1本~3本のトラツ ク上にレーザ光を集光させることによりトラック上に記 録されている記録情報を読み出す方法が用いられてい る。そして光デイスク装置ではこの読み出し方法を前提 とした様々なトラツキングエラー検出方法が確立されて いる。例えば3ビーム法、プツシュブル法、DPD (Di fferential Phase Detection) 法等である。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで一本のレーザ 光により一度に読み出すことができる記録情報量を今以 40 上に向上させるためには4本以上のトラツクから記録情 報を一度に読み出すことが一つの解決策とも考えられる が、このような光デイスク装置は現在実用化されておら ず、従つてそのトラツキングエラーの検出法としても確 立されたものがない。

【0004】本発明は以上の点を考慮してなされたもの で、簡易な構成でありながら従来以上に多くのトラツク から記録情報を同時に読み出すことができる光デイスク 及び光デイスク装置を提案しようとするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた め本発明の光デイスクにおいては、複数のトラック(T R<sub>\*1</sub>~TR<sub>\*4</sub>)でなるトラック東がパラレルスパイラル 状に形成されており、かつトラツク東間のトラツク間隔 (d2)はトラツク東内のトラツク間隔(d1)より広

く形成されている。

【0006】また本発明の光ディスクにおいては、複数 のトラック (TR<sub>11</sub>~TR<sub>14</sub>) でなるトラック束がパラ レルスパイラル状に形成されており、かつトラツク束間 のトラツク間隔(d2)はトラツク東内のトラツク間隔 (d1) より広く形成されている光デイスク(5)の所 定領域を照射し、その反射光を受光素子(6)上に結像 する光ビツクアツブ部(1)と、受光素子(6)上に並 んだ複数の受光セル (RF1~RF4、T1、T2)か らそれぞれ出力される出力信号の差出力に基づいてトラ ツキングエラー信号を生成する信号処理部とを備える。 [0007]

【作用】複数のトラツク(TR<sub>k1</sub>~TR<sub>k4</sub>)でなるトラ ツク束をパラレルスパイラル状に形成し、かつトラツク 20 東間のトラツク間隔(d2)をトラツク東内のトラツク 間隔(d1)より広く形成することにより特別な光学系 を用いなくてもトラツキングエラーを検出でき、複数の トラツクから記録情報を同時に読み出すことができる。 [0008]

【実施例】以下図面について、本発明の一実施例を詳述 する。

## 【0009】(1) 光ディスク

この実施例の光デイスクは、4本のトラツクを1単位と したトラツク束(以下、パンドという)がパラレルスパ イラル状に形成されているものとする。図1にそのトラ ツク配列を示す。図1は受光面上に光デイスクの情報記 録面を結像したものである。因に図面上の濃淡はピット の有無を表しており、明るいところはピットがない所、 暗いところはピツトが有るところを表している。

【0010】ただしこの光ディスクの場合、図1に示す ように、バンド内のトラツク間隔 d 1 よりバンド間のト ラツク間隔 d 2 が広く(すなわち d 2 > d 1) なるよう にトラツクを記録するものとする。このトラツク間隔の 違いを用いて、次項以降に説明する光デイスク装置はト ラツキングエラーを検出するようになされている。

【0011】(2)光ピツクアツブの構成

#### (2-1)全体構成

この項では、図2を用いて光ピツクアツブ1の全体構成 を説明する。光ピックアップ1は所定の発光領域をもつ 発光ダイオード2の他、複数の光学素子によつてなる。 発光ダイオード2から射出された光ビームはハーフミラ -3を透過した後、対物レンズ4によつて集光され、光 デイスク5上を照射する。このとき光ビームは光デイス ク5上に形成された複数のトラックにまたがる所定領域 50 を照射する。

【0012】光デイスクの表面において反射された反射光は対物レンズ4を介して集光された後、ハーフミラー3によつて反射され、光検出器6の受光面上に結像される。この光検出器6の受光面には図1の結像パターンに対応するように、すなわち光デイスク5のトラックビッチに合うように受光セルが配置されている。因に受光セルの領域は発光ダイオード2の発光領域にレンズバッケージの横倍率n、を乗じた領域で与えられる。またこれら受光セルは光検出器6上に結像されるビットの大きさとトラックビッチに応じた間隔で配置されている。例え 10 ぱ光検出器6上に集光されるビットの像が光デイスクのビットの大きさに対物レンズの倍率n、を乗じた大きさとなることによる。受光セルは受光面に結像されたトラックビッチと同じビッチd1で配置するものとする。

【0013】さてこれら受光セルによつて検出された光検出信号は個別にトラツキングエラー検出回路部7に供給され信号処理される。すなわちトラツキングエラー検出回路部7は入力された光検出信号をトラツクごとにそのまま加算又は重み付けられてから加算される等の信号処理を経て出力端子から出力される。ここで第1の出力20端子からは光デイスク5から読み出された情報信号(RF信号)が出力され、第2の出力端子からはトラツキング誤差信号が出力され、第3の出力端子からはフォーカス誤差信号が出力される。このトラツキングエラー検出回路部7の詳細な内部構造については次項において説明する。

【0014】(2-2)トラツキングエラー検出回路部の構成

トラツキングエラー検出回路部7の構成を図3に示す。 ここで受光セルRF1〜RF4は各トラツクの明暗パターンをRF信号として検出するのに用いるRF検出用である。またその両端に配置されている受光セルT1及びT2はトラツキングエラーの検出用である。トラツキングエラー検出回路部7は受光セルRF1〜RF4から出力されたRF信号をRF増幅器7Aに入力して増幅するようになされている。RF増幅器7Aで増幅されたRF信号はデイジタル信号処理回路7Bによつてそれぞれ復調された後、出力コントローラ7Cに供給され、メモリ7Dに記憶される。

【0015】また出力コントローラ7 Cから出力された 40 デイジタル情報信号は信号処理回路7 Eに供給されてディジタル/アナログ変換され、その後、出力端子からアナログ情報信号(音声信号、映像信号等)として出力される。また受光セルT1、T2及び受光セルRF1~RF4からの出力は信号処理回路7 Fに取り込まれ、次項において説明する検出原理に基づいてトラツキグエラーが検出される。この検出結果はトラツキングエラー信号としてサーボ回路7 Gに取り込まれ、トラツキング誤差信号及びフォーカス誤差信号として出力される。

【0016】(3)トラツキングエラー検出原理

最後に信号処理回路7 Fによるトラツキングエラーの検 出原理を説明する。信号処理回路7 Fは受光セルRF1 ~RF4及びT1、T2から入力される6つのRF信号 に基づいてトラツキングのずれを検出することができ る。次にトラツキングがあつている際に各受光セルから 出力される出力レベルとずれがある場合に各受光セルか ら出力される出力レベルの分布を示す。

【0017】まず図4(A)がトラツキングが合つている場合における各受光セルの強度分布である。この状態ではトラツキングエラーの検出用に設けられている受光セルT1及びT2の出力レベルが等しくなる。この状態からトラツキングがずれていく様子が図4(B)~図4(G)である。

【0018】このうち図4(B)、図4(D)、図4(E)の状態は受光セルT1及びT2から出力される出力レベルの強度分布が異なるためトラッキングエラーを検出することができる。これに対して図4(C)、図4(F)、図4(G)の状態はトラッキングがずれているが受光セルT1及びT2の出力レベルが等しい。しかしての場合にも、例えば図4(C)の状態に示すように、受光セルRF4だけがバンド間のギヤップ上に位置しているため他のRF受光セルより強度が強くなつている。図4(F)、図4(G)の場合も同様で必ず1つの受光セルの強度が高くなつている。

【0019】このようにトラツキングがずれている場合にはバンド間のギャツブ上にだけ強度の高い受光セルが得られる。従つて受光セルT1及びT2の出力レベルが等しい場合にはRF信号検出用の受光セルRF1~RF4のうちで強度が最も強くなつている受光セルを検出することによりトラツキングのずれている方向と量とを検出することができるのである。

【0020】これにより4本のトラツクから記録情報を同時に読み出すことができる光デイスク装置を実現できる。またこのトラツキングエラーの検出には特別な光学系を必要としないため光ピックアツブの小型化及び低価格化を実現することができる。

#### 【0021】(4)他の実施例

なお上述の実施例においては、4本のトラツクから記録情報を同時に読み出す場合について述べたが、本発明は これに限らず、2本以上のトラツクから記録情報を読み 出す場合にも適用し得る。この場合にも同時に読み出す 複数のトラツクを1バンドとするとき、バンド内のトラ ツクの間隔よりバンド間のトラツクの間隔を広くとるよ うにすれば良い。

## [0022]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、複数のトラックでなるトラック東をパラレルスパイラル状に形成し、かつトラック東間のトラック間隔をトラック東内のトラック間隔より広く形成することにより特別な光学系50 を用いなくても複数のトラックから記録情報を同時に読

み出すことができる光デイスクを容易に得ることができる。また複数のトラックから記録情報を同時に読み出すのに特別な光学系を用いなくて済む光デイスク装置を得ることができる。

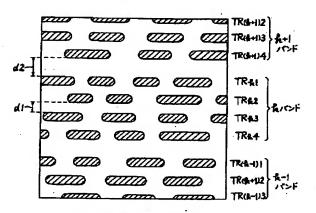
### 【図面の簡単な説明】

【図1】光検出器の受光面に結像されたトラツクバター ンを示す略線図である。

【図2】光ピツクアツブの構造を示す略線図である。

【図3】トラツキングエラー検出回路部の構成を示すブ\*

# 【図1】



図| 光検出器の受光面

# [図4]

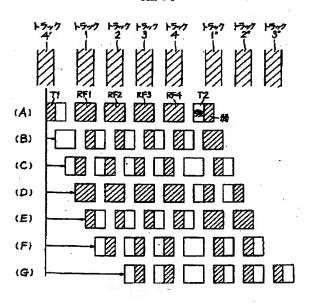


図4 受光セルの光強度分布

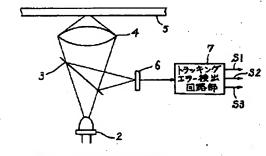
## \*ロツク図である。

【図4】トラツキングのずれと各受光セルから出力される出力レベルの分布関係を示す略線図である。

## 【符号の説明】

1 ……光ピツクアツブ、2 ……発光ダイオード、3 …… ハーフミラー、4 ……対物レンズ、5 ……光デイスク、 6 ……光検出器、7 ……トラツキングエラー検出回路 部。

#### 【図2】



四2 光ピックアップの構成

# [図3]

